

기능 명세서

기능 명세서

기 요구 사항 ID	Aa 기능 ID	기능 명	기능 상세 설명	우선순위	담당자
<u>REQ-001</u>	<u>AUTH-001</u>	페이지 접근	허용된 IP만 접근이 가능하다.	Middle	
<u>REQ-002</u>	<u>LIST-001</u>	Wafer 리스트 조회	Wafer 리스트를 조회할 수 있다. Wafer 컬럼:	High	
<u>REQ-002</u>	<u>LIST-002</u>	Wafer 리스트 필터링	Wafer 리스트를 필터링할 수 있다. 필터링 기준: ...	Middle	
<u>REQ-002</u>	<u>LIST-003</u>	Wafer 리스트 검색	Wafer 리스트를 특정 기준으로 검색할 수 있다. 검색 기준:...	Middle	
<u>REQ-002</u>	<u>LIST-004</u>	Wafer 상세 페이지 이동	Wafer를 클릭하면 상세 조회 페이지로 이동한다. 상세 정보는 메인 서버가 각 모듈에 요청을 보내 한번에 받아온다. SFTP...	High	
<u>REQ-003</u>	<u>CONNECT-001</u>	모듈 연결 상태 확인	8개의 검사 모듈의 네트워크 연결 상태를 확인할 수 있다. 모듈 연결 상태는 Polling으로? 모듈 별로 점멸등으로 표시	Middle	
<u>REQ-004</u>	<u>DETAIL-001</u>	Wafer 3 step 통합 조회	개별 Wafer에 대해 3 step 검사 결과를 통합하여 조회할 수 있다.	High	
<u>REQ-004</u>	<u>DETAIL-002</u>	Wafer Map 조회	Defect List에 대한 Wafer Map을 확인할 수 있다. 1, 2, 3 Step 별 Defect는 서로 다른 색상으로 표시된다. 각 Step을 토크 방식으로 선택하여 하나의 Wafer Map에 중첩으로 표현할 수 있다.	High	
<u>REQ-004</u>	<u>DETAIL-003</u>	Golden, Macro 이미지 조회	각 스텝에 대한 Golden, Macro 이미지를 조회할 수 있다.	High	

ㄱ 요구 사항 ID	Aa 기능 ID	≡ 기능 명	≡ 기능 상세 설명	⬇️ 우선순 위	👤 담당 자
<u>REQ-004</u>	<u>DETAIL-004</u>	Defect List 조회	각 스텝에 대한 Defect List를 조회할 수 있다.	High	
<u>REQ-004</u>	<u>DETAIL-005</u>	IPU 이미지 조 회	각 Defect에 대해 IPU 이미지를 조회할 수 있다. IPU 이미지는 Golden, Macro, Binary, PSM으로 구성된다.	High	
<u>REQ-004</u>	<u>DETAIL-006</u>	EBR 데이터 조 회	EBR 데이터를 조회할 수 있다. EBR 데이터는 이미지와 세부 컬 럼으로 구성된다.	High	
<u>REQ-005</u>	<u>MAKE-001</u>	데이터 생성 요 청	검사 모듈에 데이터 생성을 요청 한다. v1: 데이터 생성은 다음과 같은 과정으로 수행된다. 1. MAKE 서버는 랜덤한 16개의 레시피를 선택한다. 2. 레시피에 따라 각 모듈에 순차 적으로 동기적으로 요청을 보낸 다. 3. 3개의 모듈에 정상적으로 요 청이 완료되면 summary 데이터 를 DB에 저장한다.	Middle	
<u>REQ-006</u>	<u>MODULE-001</u>	데이터 생성 및 저장	MAKE 서버가 요청한 데이터 생 성 및 저장 프로세스를 수행한다. 1. 요청이 오면 1개의 Lot에 대한 데이터를 생성한다. 2. 데이터는 smf, img, json으 로 구성된다. 3. 각 모듈의 스토리지에 저장한 다.	Middle	

기능 명세서 요약

1. 전체 웨이퍼 조회

- SummaryDB에 저장된 전체 웨이퍼를 조회
- 날짜, lot, recipe를 기준으로 조회 가능

2. 세부 웨이퍼 조회

- 선택한 웨이퍼를 조회
- 선택된 웨이퍼의 history도 확인 가능

3. 세부 웨이퍼의 Wafer Map 조회 (3 STEP)

- Wafer Map은 확대/축소 기능 제공
- 결함 좌표는 점으로 표현
- 웨이퍼의 Die는 규격에 맞게 그려짐

4. 세부 웨이퍼의 Macro 조회

- PPID, LOT, WAFER, Macro 정보를 기준으로 BMP 파일 조회
- IPU에서 이미지를 조회

5. 세부 웨이퍼의 Golden 조회

- Golden 이미지로 대체하여 조회

6. 세부 웨이퍼의 EBR 조회

- ebr 이미지 조회

7. 각 모듈에서 정보 조회

- 각 웨이퍼를 구별할 수 있는 KEY는 PPID, lotId, slotId로 구성
- 각 모듈의 파일 구조와 KEY를 기반으로 데이터 조회